

【共同利用機器リスト(管理部局別)】

管理部局	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	学内(※1)		学外		
					分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金	
					(円/件)	(円/時間)	(円/件)	(円/時間)	
中央分析センター	伊都	超高分解能電界放出型走査電子顕微鏡 (SU8000)	W3-105	渡辺 (90-2857)	23,000	3,900	28,000	7,600	
		低真空分析走査電子顕微鏡 (SU6600)	W3-103	材工・大上助教 (90-2948)	18,000	3,700	25,000	13,000	
		電子線後方散乱結晶方位解析装置 (Velocity)			1,100(※2)	560(※2)	12,000(※2)	2,400(※2)	
		低真空高感度走査電子顕微鏡 (SU3500)	W3-102	渡辺 (90-2857)	9,300	2,100	12,000	4,000	
		走査電子顕微鏡 (JSM-IT700HR)	W3-101		9,500	2,400	20,000	17,000	
		大気圧走査電子顕微鏡 (AeroSurf1500)	W3-102		8,300	2,000	10,000	3,400	
		全自動水平型多目的X線回折装置 (SmartLab)	W3-202		15,000	3,000	17,000	5,500	
		全自動水平型多目的X線回折装置 (SmartLab-TFV)	W3-206		19,000	5,900	42,000	13,000	
		デスクトップX線回折装置 (MiniFlex600-C)	W3-202		8,800	2,000	9,500	2,600	
		エネルギー分散型蛍光X線分析装置 (EDX-7000)	W3-203		5,700	3,200	6,100	4,600	
		微小部X線分析装置 (XGT-9000)	W3-203		5,200	2,200	21,000	5,200	
		高分解能3次元X線CTシステム (SKYSCAN1172)	W3-104		34,000	2,700	56,000	6,500	
		高分解能卓上型マイクロCTシステム (SKYSCAN1272)	W3-104		46,000	4,600	55,000	7,100	
		フーリエ変換赤外分光光度計 (FT/IR-620)	W3-205		6,100	920	6,100	920	
		フーリエ変換赤外分光光度計 (FT/IR-4700)	W3-205		5,700	1,100	5,800	1,300	
		マルチチャンネル赤外顕微鏡システム	W3-205		12,000	3,600	13,000	5,500	
		顕微レーザーラマン分光装置 (LabRAM ARAMIS)	W3-207		21,000	5,800	33,000	14,000	
		顕微レーザーラマン分光測定装置 (LabRAM HR Evolution)	W3-207		7,800	12,000	24,000	17,000	
		自動薄膜計測装置 (Auto SE)	W3-206		6,600	1,300	7,900	2,600	
		超伝導核磁気共鳴吸収装置 (JNM-ECZ400)	W3-110		6,500	1,400	8,800	—	
		超伝導核磁気共鳴吸収装置 (JNM-ECZ500)	W3-110		応化・清水准教授 (90-2867)	13,000	1,900	15,000	—
		誘導結合プラズマ質量分析装置 (Agilent 7700x)	W3-106		渡辺 (90-2857)	12,000	6,500	12,000	9,600
		誘導結合プラズマ質量分析装置 (Agilent7900)	W3-106			12,000	5,800	27,000	9,600
		示差熱熱重量同時測定装置 (TG/DTA7300)	W3-201			15,000	2,400	19,000	4,000
		高感度示差走査熱分析装置 (X-DSC7000)	W3-201			15,000	2,400	19,000	4,000
		高温型示差走査熱分析装置 (DSC6300)	W3-201			15,000	2,400	19,000	4,000
		示差熱熱重量同時測定装置 (NEXTA STA300)	W3-201	—		1,800	—	2,400	
		高温型示差走査熱量計 (DSC404F1)	W3-201	—		6,800	—	9,300	
		走査型プローブ顕微鏡 (Dimension FastScan)	W3-204	17,000		3,100	20,000	5,100	
		走査型プローブ顕微鏡 (DimensionIcon)	W3-204	4,500		7,700	19,000	11,000	
		3D測定レーザー顕微鏡 (OLS4500)	W3-201	13,000		2,500	14,000	3,300	
		フラットミリング装置 (IM-3000)	W3-103	材工・大上助教 (90-2948)		—	1,500	—	2,100
		イオンミリング装置 (E-3500)	W3-103			—	1,500	—	2,100
イオンコーティング装置 (JFC-1600)	W3-101, 105	渡辺 (90-2857)	1,400	930		1,400	930		
イオンスパッタ (MC1000)	W3-102		3,000	1,900	3,100	2,000			
カーボンコータ (SC-701C)	W3-102		2,700	2,100	2,700	2,300			
オスミウムコータ (HPC-1SW)	W3-102, 105		3,100	3,200	3,100	3,600			

管理部局	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	学内(※1)		学外	
					分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金
					(円/件)	(円/時間)	(円/件)	(円/時間)
中央分析センター	筑紫	電子線 3次元粗さ解析装置 (ERA-8900)	中分-102	荻原准教授 (93-7149)	—	1,400	—	3,900
		電界放出形走査電子顕微鏡 (JSM-6701F)	中分-102		—	2,500	—	3,700
		電界放出形走査型電子顕微鏡 (JSM-IT800SHL)	中分-201		5,500	3,300	9,400	8,400
		X線回折装置 (SmartLabSE)	中分-202		—	2,900	—	5,100
		波長分散型蛍光 X線分析装置 (ZSX PrimusIV/RX9)	中分-201		5,000	4,400	9,000	9,100
		卓上型触針式プロファイリングシステム (DektakXT-E)			3,900	2,600	5,900	4,400
		ゼータ電位・粒径測定システム (ELSZneo)	中分-306		4,200	3,700	6,300	6,200
		ICP発光分光分析装置 (Avio220Max)	中分-307		3,600	5,400	4,900	7,700
		赤外分光分析装置 (FTIR4200 & IRT5000)	中分-306		—	4,300	—	4,600
		走査型プローブ顕微鏡 (AFM100Plus)	中分-201		8,400	4,500	14,000	8,000
		超高感度示差走査熱量計 (DSC6100)	中分-306	—	1,700	—	1,700	
		高感度示差走査熱量計 (DSC6220)	中分-307	—	1,600	—	1,600	
		X線光電子分光分析装置 (AXIS165)	中分-103	23,000	—	28,000	—	
工学 研究院	伊都	ショットキー走査電子顕微鏡 (SU5000)	W4-121-3	田中(将)教授 (90-2950)	—	3,500	—	5,100
		オールインワン蛍光顕微鏡 (BZ-X800)	W3-609	岸村准教授 (90-2851)	—	660	—	1,300
		フローサイトメーター (CytoFLEX S)	W1-D909	森教授 (90-2849)	—	2,500	—	—
		レーザーラマン分光光度計 (NRS-3100KK)	W3-114	森川(全)助教 (90-2922)	5,000/時間	2,300	5,000/時間	2,300
		近赤外蛍光分光装置 (NanoLOG-EXT)	W3-612	白木准教授 (90-2841)	—	1,100	—	—
		原子吸光分光光度計 (AA-7000)	W3-512	若林准教授 (90-2809)	—	6,400	—	—
		磁化率測定装置 (MPMS-XL7TZ)	CE61-102	河江准教授 (90-3521)	—	550	—	550
		差動型高温示差熱天秤 (TG-DTA2020SA)	W2-1001	小宮助教 (90-3431)	—	2,900	—	2,900
		攪拌混合造粒機 パーチカルグラニューレータ	W4-306	井上教授 (90-2757)	—	3,500	—	3,800
		整粒・微粉碎ラボシステム	W4-710		6,500	3,200	6,900	3,600
		卓上型混練機	コラボスペース 204		28,000	3,700	32,000	4,600
		卓上型テストコーター ミニラボ	W4-710		8,300	3,200	9,000	3,700

管理部局	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	学内		学外	
					分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金
					(円/件)	(円/時間)	(円/件)	(円/時間)
工学 研究院	伊都	UV-Vis-NIR 分光光度計	W3-115	ARIM 事務室 (90-2845)	-	610	-	-
		全自動水平型多目的 X 線回折装置 (SmartLab)			-	2,300	-	-
		ガス吸着装置	W3-112		-	410	-	-
		触媒活性表面測定システム			-	400	-	-
		マイクロ構造観察電子顕微鏡システム	W3-114		-	3,000	-	-
		超高分解能走査電子顕微鏡			-	1,600	-	-
		CCD マルチ ICP 発光分光分析装置	W3-116		-	2,800	-	-
		電子状態測定システム			-	3,400	-	-
		ゼータ電位/粒径測定システム	W3-607		-	1,100	-	-
		高速レーザーラマン顕微鏡			-	2,000	-	-
		中赤外・遠赤外吸収測定装置	W3-113		-	690	-	-
		超高速 HPLC 分離・分子構造分析システム	W3-113, 114		-	1,900	-	-
		MALDI-TOF MS 質量分析装置	W3-114		-	2,300	-	-
		小角 X 線散乱装置	W3-115		-	990	-	-
		単結晶 X 線解析装置			-	870	-	-
		走査型プローブ顕微鏡 SPM9600	W3-113		-	3,500	-	-
		ウルトラマイクローム EM UC7	W3-116		-	1,600	-	-
		3次元 SEM 画像測定解析システム VE-8800	W3-114		-	1,100	-	-
マイクロカロリメーター PEAQ-ITC	W3-113	永井助教 (90-2831)	-	2,200	-	-		
人間環境 学研究院	伊都	万能試験機 (UH-2000kNXR)	イ-ストリ-ン 構造実験棟	小山准教授 (90-5223)	-	2,400	-	3,100
		万能試験機 (UH-500kNX)			-	1,800	-	2,400
		大型構造物試験機		松尾准教授 (90-5225)	-	15,000	-	19,000
		振動台			-	11,000	-	14,000
		汎用アクチュエータ			-	11,000	-	15,000
		精密万能試験機オートグラフ			-	2,200	-	2,800
		動的・疲労試験システム			-	4,700	-	6,100
農学 研究院 (※3)	伊都	高速液体クロマトグラフ質量分析計 (LCMS-IT-TOF)	W5-305a	赤坂技術職員 (90-4801)	11,000	1,300	11,000	1,300
		高速液体クロマトグラフ質量分析装置 (LCMS-8050)	W5-305a		8,400	1,600	8,400	1,600
		ガスクロマトグラフ (GC-2014AFsc)	W5-305b	松永技術職員 (90-4801)	3,000	460	3,000	460
		誘導結合プラズマ発光分光分析計 (5800 ICP-OES)	W5-305c		1,400	4,600	1,900	6,000

管理部署	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	学内		学外		
					分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金	
					(円/件)	(円/時間)	(円/件)	(円/時間)	
農学 研究院 (※3)	伊都	共焦点・超解像顕微鏡 TCS SP8 STED	W5-307b	奥川技術職員 (90-4801)	19,000	3,400(※5)	52,000	14,000	
		セルソーター Sony SH800	W5-307a		—	1,800(※4)	—	4,700(※4)	
		核磁気共鳴装置 (JNM-ECS400)	W5-115	鹿児島技術職員 (90-4801)	5,600	1,300	5,600	1,300	
		走査型電子顕微鏡システム (SU3500)	W5-116	山口技術職員 (90-4801)	5,300	1,400	5,300	1,400	
		デジタルマイクロスコプ (VHX-6000)	W5-307c		5,000	1,100	5,000	1,100	
		凍結切片作製装置 (CryoStar NX70)	W5-311	鶴田技術専門員 (90-4801)	—	420	—	850	
		回転式マイクロトーム (HistoCore AUTOCUT R)			—	360	—	700	
総合理工 学研究院	筑紫	X線回折計 (Rigaku RINT2200)	総理工 C-107	永長教授 (93-7525)	—	7,100/件	—	7,100/件	
		蛍光X線分析装置 (Rigaku ZSX-miniX)			—	21,000/件	—	21,000/件	
		宇宙空間模擬装置 (※10)	高速流動棟	山本教授 (93-7585)	—	550	—	1,100	
		レーザーラマン分光装置 (Nanofinder 30)	GIC 実験室 5	吾郷教授 (93-8852)	—	8,500/件	—	8,500/件	
先導物質 化学 研究所	筑紫	デジタルマイクロスコプ (VHX-900F)	先導研 南-109	田中(雄)技術職員 (93-8898)	890	—	1,100	—	
		走査電子顕微鏡 (JSM-IT700HR)			4,500/時間	2,400	6,400/時間	4,000	
		オスミウムコータ (Tennant20)			3,500	3,100/件	3,900	3,400/件	
		核磁気共鳴装置 (JEOL JNM-ECA600)	NMR 解析棟	出田技術職員 (93-8898)	7,900	—	7,900	—	
		固体高分解能核磁気共鳴装置 (JEOL JNM-ECA400)			23,000	—	23,000	—	
		電子共鳴装置 (JEOL JES-FA200)	先導研 南-401	出田技術職員 (93-8898)	4,500	1,900/件	4,500	1,900/件	
		超伝導核磁気共鳴装置 (JNM-ECZ400)	先導研 南-107		2,300	—	3,500	—	
		固体核磁気共鳴装置 (ECA 800)	先導研 北-107		39,000 (2,200) (※7)	2,200	46,000 (2,600) (※7)	2,600	
		固液共用核磁気共鳴装置 (JNM-ECX400) 液体・ガス測定			1,600 (540) (※7)	—	2,000 (690) (※7)	—	
		固液共用核磁気共鳴装置 (JNM-ECX400) 固体測定			7,900 (1,000) (※7)	—	11,000 (1,300) (※7)	—	
		二重収束質量分析計 (JMS-700)			4,600	—	4,600	—	
		マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型 質量分析計 (JMS-S3000)	先導研 南-215		今村技術職員 (93-8898)	3,100	—	3,600	—
		コールドスプレーイオン化飛行時型質量分析装置 (JMS-T100GS)	先導研 南-401		田中(雄)技術職員 (93-8898)	3,200	—	3,200	—
放射性物質対応型強磁性材料ナノクラスター 評価システム (JEM-ARM200CF)	先導研 南-107	村山教授 (93-7621)	211,000		—	395,000	—		

管理部門	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	学内		学外	
					分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金
					(円/件)	(円/時間)	(円/件)	(円/時間)
先導物質 化学 研究所	伊都	二波長線源型高分解能単結晶 X 線構造解析装置	先導研 北-421	松本技術職員 (93-8898)	30,000	6,200	33,000	7,600
		高輝度広角 X 線回折システム薄膜解析部 (RINT-TTRⅢ)	先導研 北-205		20,000	—	24,000	—
		超高感度測定用 NMR 装置 (AVANCEⅢ 600)	CE41-107	谷准教授 (90-6224)	—	850	—	850
		高分解能二重収束質量分析装置 (JMS-700)	CE41-110	岡崎技術補佐員 (90-6219)	4,700	—	8,500	—
		飛行時間型質量分析計 (JSM-T100GS)	CE41-110	五島助教 (90-6225)	—	370	—	370
		マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型 質量分析装置 (Bruker Autoflex Ⅱ)			—	400	—	400
		X 線光電子分光分析装置 (ULVAC-PHI APEX ESCA)	CE41-112	大路テクニカルスタッフ (90-6214)	23,000	940	23,000	940
		二光子共焦点レーザー顕微鏡 (Carl Zeiss LSM 510 Meta NLO)			11,000	650	11,000	650
先端素粒子 物理研究 センター	伊都	シリコン検出器製造装置	W1-E-801	東城准教授 (90-4053)	—	5,200(※6)	—	5,200(※6)
比較社会 文化 研究院	伊都	フィールドエミッション電子プローブマイクロ アナライザ (JXA-8530F)	E1-C-723	中野准教授 (90-5656)	105,000	—	105,000	—
		高分解能重元素質量分析システム レーザーアブレーション ICP-MS	E1-C-107-3		118,000	—	125,000	—
					94,000	—	94,000	—
		軽元素同位体分析システム (MAT 253)	E1-C-717	仙田准教授 (90-5653)	99,000	—	265,000	—
		デスクトップ X 線回折装置 (MiniFlex600)	E1-C-701	桑原教授 (90-5654) 林講師 (90-5655)	—	2,200	—	2,200
薬学 研究院	病院	核磁気共鳴装置 (AVACE Ⅲ HD 500) (※9)	薬学部本館 2 号館 2102	矢崎准教授 (91-6669)	—	600	—	7,600
歯学 研究院	病院	ゼータ電位測定システム	歯学部本館 4 階	岸田助教 (91-6346)	—	850	—	9,300
生体防御 医学 研究所	病院	高性能透過型電子顕微鏡 (FEI Polara) (※8)	生体防御医学 研究所別館 高性能 TEM 室	鵜川技術職員 (91-6798)	3,500/時間	3,500	5,500/時間	3,500
		汎用透過型電子顕微鏡 (FEI Tecnai20)	生体防御医学 研究所別館 汎用 TEM 室		1,500/時間	—	3,500/時間	—
		FACSVerse フローサイトメーター	生体防御 医学研究所		—	1,800	—	1,800
		細胞単離解析システム (FACSMelody)			—	3,000	—	4,000
		細胞単離解析システム (FACSMelody) : Yellow-Green レー ザー搭載型			—	3,000	—	4,000

管理部局	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	学内		学外	
					分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金
					(円/件)	(円/時間)	(円/件)	(円/時間)
生体防御 医学 研究所	病院	凍結切片作製装置 クリオスタット CM3050S	生体防御 医学研究所	市川技術職員 (91-6798)	—	300	—	—
		実験動物用 CT 装置 CosmoScan FX		市川技術職員 (91-6963, 6973)	—	4,100	—	—
		Chromium コントローラー		木庭技術職員 (91-6778)	—	4,000/件	—	4,000/件
		回折装置 バイオアナライザー			—	780/件	—	780/件
		共焦点レーザー顕微鏡 LSM700			—	670	—	5,100
		次世代共焦点顕微鏡システム LSM980 with Airyscan2			—	670	—	6,600

管理部局	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	分類	学内		学外		
						分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金	
						(円/件)	(円/件)	(円/件)	(円/件)	
生体防御 医学 研究所	病院	次世代シーケンサー (NovaSeq 6000)	生体防御 医学研究所 技術支援室	吉村テクニカルスタッフ (91-6798)	S1	100 塩基	861,000	853,000	916,000	910,000
						200 塩基	1,082,000	1,074,000	1,137,000	1,131,000
						300 塩基	1,170,000	1,162,000	1,225,000	1,219,000
					S2	100 塩基	1,612,000	1,604,000	1,667,000	1,661,000
						200 塩基	1,998,000	1,990,000	2,053,000	2,047,000
						300 塩基	2,131,000	2,123,000	2,186,000	2,180,000
					S4	35 塩基	2,330,000	2,321,000	2,385,000	2,379,000
						200 塩基	2,865,000	2,857,000	2,920,000	2,914,000
						300 塩基	3,191,000	3,183,000	3,246,000	3,240,000
					SP	100 塩基	475,000	466,000	530,000	524,000
						200 塩基	618,000	610,000	673,000	667,000
						300 塩基	673,000	665,000	728,000	722,000
500 塩基	939,000	930,000	994,000	987,000						

- (※1) 中央分析センターが管理部局となっている設備については、試料の分析等の依頼者が九州・山口地区機器・分析ネットワークの構成機関に所属する者である場合は、本学が管理する経費から支出される場合の利用料とすることができる。
- (※2) SEM(SU6600)料金にEBSDを使用した時間分を加算する。
- (※3) 技術補助が必要な場合は、1時間当たり3,900円を加算する。
- (※4) ソーティングチップを使用する場合は、1枚当たり3,600円を加算する。
- (※5) チャンバーを使用する場合は、1個当たり880円を加算する。
- (※6) 機器の操作説明が必要な場合は、1時間当たり3,300円を加算する。
- (※7) ()内の額に使用する時間数を乗じたものを加算する。
- (※8) 学外利用者の場合、準備料として1回当たり5,500円を加算する。
- (※9) 試料の分析等を依頼する場合は、分析受託料として1件当たり1,300円(本学が管理する経費から支出される場合は1,000円)を加算する。サンプル調整が必要な場合は、利用料及び分析受託料に加えてサンプル調整料として1件当たり1,200円(本学が管理する経費から支出される場合は1,000円)を加算する。
- (※10) キセノンガスを使用する場合は、1リットルあたり5,800円を加算する。クリプトンガスを使用する場合は、1リットルあたり220円を加算する。